

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年5月25日(25.05.2023)



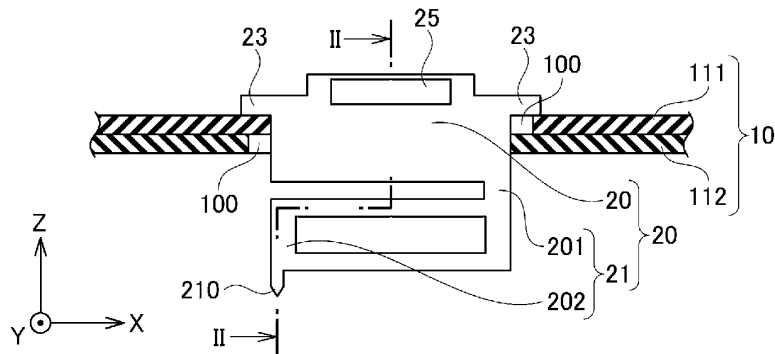
(10) 国際公開番号

WO 2023/090062 A1

- (51) 国際特許分類:
G01R 1/06 (2006.01) H01L 21/66 (2006.01)
G01R 1/073 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/039498
- (22) 国際出願日: 2022年10月24日(24.10.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-189201 2021年11月22日(22.11.2021) JP
- (71) 出願人: 株式会社日本マイクロニクス(KABUSHIKI KAISHA NIHON MICRONICS)
[JP/JP]; 〒1808508 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目6番8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 竹谷 敏永 (TAKEYA Toshinaga);
〒1808508 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目6番8号 株式会社日本マイクロニクス内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 三好 秀和, 外 (MIYOSHI Hidekazu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号 虎ノ門琴平タワー Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,

(54) Title: PROBE STORAGE JIG, PROBE STORAGE SYSTEM, AND PROBE STORAGE METHOD

(54) 発明の名称: プローブ格納治具、プローブ格納システムおよびプローブ格納方法



(57) Abstract: This probe storage jig stores a probe that includes an arm portion having a cantilever structure and a supporting portion connected to a fixed end of the arm portion. The probe storage jig has a configuration in which a first guide plate and a second guide plate are stacked on one another. A through-hole penetrating through from an upper surface to a lower surface is formed in each of the first guide plate and the second guide plate. The probe storage jig holds the probe, penetrating through the through-holes in each of the first guide plate and the second guide plate, in a state in which an upper portion of the supporting portion is exposed when seen from above the probe storage jig, and a tip end of a free end of the arm portion is exposed when seen from below the probe storage jig. The probe storage jig is configured such that the first guide plate and the second guide plate can move in such a way that the probe is sandwiched between the first guide plate and the second guide plate.

[続葉有]

TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約：プローブ格納治具は、カンチレバー構造のアーム部およびアーム部の固定端に接続する支持部を有するプローブを格納する。プローブ格納治具は、第1ガイドプレートと第2ガイドプレートとを積層した構成を有する。第1ガイドプレートと第2ガイドプレートのそれぞれに、上面から下面まで貫通する貫通孔が形成されている。プローブ格納治具は、プローブ格納治具の上方から見て支持部の上部が露出し、プローブ格納治具の下方から見てアーム部の自由端の先端が露出した状態で、第1ガイドプレートおよび第2ガイドプレートのそれぞれの貫通孔を貫通したプローブを保持する。プローブ格納治具は、第1ガイドプレートと第2ガイドプレートによりプローブを挟むように、第1ガイドプレートと第2ガイドプレートが移動可能に構成されている。